



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23649—2009/ISO 14981:2000

GB/T 23649—2009/ISO 14981:2000

## 印刷技术 过程控制 印刷用反射密度计的光学、 几何学和测量学要求

Graphic technology—Process control—  
Optical, geometrical and metrological requirements for  
reflection densitometers for graphic arts use

(ISO 14981:2000, IDT)

中华人民共和国  
国家标准  
印刷技术 过程控制  
印刷用反射密度计的光学、  
几何学和测量学要求

GB/T 23649—2009/ISO 14981:2000

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 24 千字

2009年8月第一版 2009年8月第一次印刷

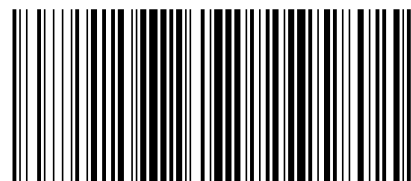
\*

书号: 155066·1-38082 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 23649-2009

2009-05-06 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 技术要求 .....	3
5 检测方法 .....	6
6 报告 .....	7
附录 A (规范性附录) 带偏振装置的测量仪器所使用的认证参照材料(CRM) .....	8
附录 B (规范性附录) 偏振测试体 .....	9
参考文献 .....	10

## 参 考 文 献

- [1] ISO 5-1:1984 摄影 密度测量 第1部分:术语、符号和标志
- [2] ISO 5-4:1995 摄影 密度测量 第4部分:反射密度的几何条件
- [3] GB/T 17934.1—1999 印刷技术 网目调分色片、样张和印刷品成品的加工过程控制 第1部分:参数及测试方法
- [4] T CELIO, F MAST, H OTT. 光学反射密度测量中偏振片的使用. *Journal of Imaging Technology*, 1991, 17(1):2-4
- [5] BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. 测量学基本通用术语国际词汇(VIM). 第2版, 1993年
- [6] CIE 17.4:1987 国际照明词汇
- [7] ISO 10526:1999/CIE S 005/E—1998 色度学用 CIE 标准照明体

## 前 言

本标准等同采用 ISO 14981:2000《印刷技术 过程控制 印刷用反射密度计的光学、几何学和测量学要求》。

为了便于使用,本标准对 ISO 14981:2000 做了下列编辑性修改:

- 将“本国际标准”改为“本标准”;
- 删除 ISO 14981:2000 的前言;
- 本标准用等同采用或等效采用国际标准的相应国家标准或行业标准代替 ISO 14981:2000 的规范性引用文件中的引用标准;
- 在引言中,添加“随着印刷过程控制的规范化和数据化的实施,印刷部门和高等学校配备了各种品牌的密度计。在印刷行业制定和推行此项标准的意义在于:在采购和使用密度计时,必须保证所使用的密度计其几何学、光学和测量学等条件符合此项标准,否则,测量的结果会出现偏差,不能保证数据的可靠性”一段话。

本标准的附录 A 和附录 B 为规范性附录。

本标准由新闻出版总署提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:北京印刷学院。

本标准主要起草人:齐晓堃、金杨、武兵。